

# Comment assurer la comparabilité des niveaux de compétences de populations n'ayant pas passé les mêmes évaluations ?

Thierry Rocher

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative  
DEPP - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance

Journées de Méthodologie Statistique  
Paris, 24-26 janvier 2012

# Le problème

## Illustration :

- Quelle évolution dans le temps du niveau des élèves ?
- Dispositifs de tests standardisés organisés en cycle
- Les tests ne sont pas identiques d'un moment de mesure à l'autre (changement de programmes, exposition des items, ...)
- Assurer la comparabilité de résultats obtenus à des évaluations différentes → nécessité d'un ajustement des métriques
- $4 \times 7 \neq 7 \times 4$

## Présentation de méthodes à partir d'exemples

- ① Evaluations sur échantillons (nationales/internationales, élèves/adultes)
- ② Evaluations exhaustives

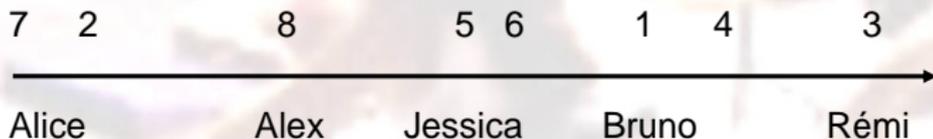


# Illustration

Passation : 24 items, 276 individus

Quelques notions de psychométrie :

- Validité : corrélation(score construit, taille réelle),  $r=0.85$
- Fidélité : à quelques exceptions près, les items forment un ensemble homogène
- Fonctionnements différentiels : quelques items selon le genre
- Echelle d'intervalle : classement des individus + métrique
- Métrique : l'échelle n'a pas d'unité pré-définie ni de 0 absolu ( $\approx$  échelles de température)

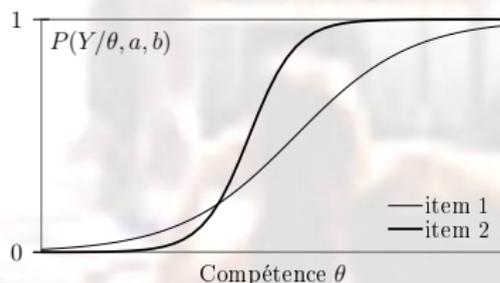


# Modèles de réponse à l'item

Modèle de réponse à l'item (2PL) :

$$P(Y_i^j = 1 | \theta_i, a_j, b_j) = \frac{\exp(Da_j(\theta_i - b_j))}{1 + \exp(Da_j(\theta_i - b_j))}$$

$Y_i^j$  : réponse de l'élève  $i$  à l'item  $j$   
 $\theta_i$  : niveau de compétence de l'élève  $i$   
 $D$  : constante qui vaut 1.7  
 $b_j$  : difficulté de l'item  $j$   
 $a_j$  : discrimination de l'item  $j$



Séparation des concepts :

- niveau de difficulté des items
- niveau de compétence des élèves

# Indétermination

Modèle de réponse à l'item (2PL) :

$$P(Y_i^j = 1 | \theta_i, a_j, b_j) = \frac{\exp(Da_j(\theta_i - b_j))}{1 + \exp(Da_j(\theta_i - b_j))}$$

Les paramètres sont définis à une transformation linéaire près :

$$\left| \begin{array}{l} \theta_i^* = A\theta_i + B \\ a_j^* = a_j/A \\ b_j^* = Ab_j + B \end{array} \right.$$

Généralement, lors de l'estimation on fixe  $\mu_\theta = 0$  et  $\sigma_\theta = 1$

Problème : comparer des élèves ayant passé deux évaluations différentes



# Cahiers tournants

- Objectif : évaluer de nombreux items sans augmenter le temps de passation
- Principe : découpage en « blocs », chaque paire de blocs est évaluée, contrôle de l'ordre de passation
- Application : évaluations d'élèves sur échantillons (PISA, CEDRE, LOLF-Socle, ...)

	1	2	3	4	5	6	7
Cahier 1	■	■	■				
Cahier 2				■	■		
Cahier 3	■					■	■
Cahier 4		■		■			
Cahier 5					■		■
Cahier 6			■	■			
Cahier 7					■	■	

# Evaluations cycliques

- Objectif : mesure de l'évolution dans le temps du niveau de compétence
- Principe : reprise à l'identique d'items communs ; la reprise complète peut s'avérer délicate (exposition des items, évolution des programmes, fonctionnement des items ...)
- Application : évaluations cycliques (PISA, CEDRE, IVQ, ...)

Année N



Année N + x



# Evaluations reprises

- Cas particulier : ancrage via des élèves
- « Lire, écrire, compter » à vingt ans d'intervalle
- Calcul

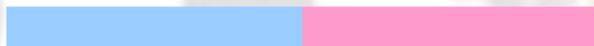
1987



1999



2007



# Evaluations multiniveaux

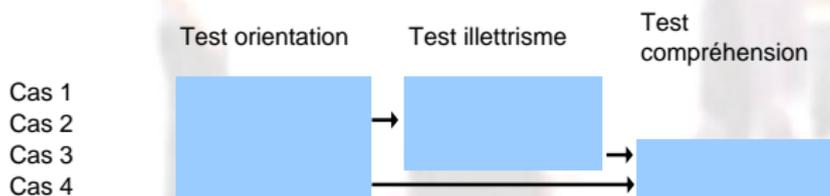
- Objectif : une même échelle de « développement »
- Application : banque d'items, suivis de cohorte (panels, internats d'excellence, ...)



# Tests adaptatifs

- Objectif : adapter la difficulté de l'item au niveau de compétence de l'individu
- Application : tests sur supports électroniques (LSE), IVQ

IVQ :



Test adaptatif LSE :

- Réponse  $Y_i^j \rightarrow$  estimation  $\hat{\theta}_i \rightarrow$  proposition d'un item adapté ( $b_j$  proche de  $\hat{\theta}_i$ )

# Principe

Comparer des groupes d'élèves non équivalents, en terme de niveau de compétence, grâce à des items communs identique

D'une session d'évaluation à l'autre :

- paramètres des items : fixes
- niveau de compétence des élèves : variable

Hypothèse

- le fonctionnement des items est identique d'un moment de mesure à l'autre
- en particulier : la hiérarchie de difficulté des items est inchangée, sinon un autre facteur que  $\theta$  a joué dans la réussite

# Estimation

Estimation conjointe (« concourrante ») :

- Utilisation de toute l'information (toutes les sessions)
- Indétermination : on fixe  $\mu_\theta$  et  $\sigma_\theta$  pour un des groupes

Limites :

- Contrainte sur la disponibilité des données (cf. PIAAC)
- Cohérence avec la diffusion des résultats et des données des sessions précédentes (ex : PISA, CEDRE)

Autre possibilité :

- fixation des paramètres des items estimés précédemment
- ex : IVQ-PIAAC



# Méthode de Stocking et Lord

On cherche les « meilleurs »  $A$  et  $B$  tels que les paramètres des items communs ( $j \in C$ ) de la 2e évaluation, transformés sur l'échelle de la 1ère ( $a_{j2}^*, b_{j2}^*$ ), soient les plus proches possibles des paramètres estimés pour la première évaluation ( $a_{j1}, b_{j1}$ ).

Pour cela, on minimise l'écart entre les probabilités de réussir les items communs, à niveau de compétence égal :

$$\min \sum_i (\xi_i - \xi_i^*)^2$$

où

$$\xi_i = \sum_{j \in C} P(\theta_i, a_{j1}, b_{j1})$$

et

$$\xi_i^* = \sum_{j \in C} P(\theta_i, a_{j12}^*, b_{j12}^*)$$

# Evaluations nationales CE1/CM2

## Contraintes :

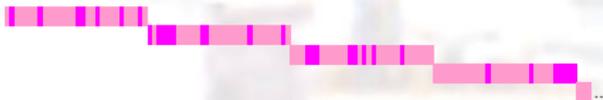
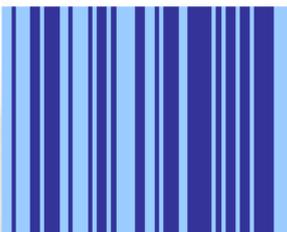
- Changement complet des épreuves chaque année, pour éviter le bachotage
- Conception et sélection des items sous contraintes
- Scores calculables localement par les enseignants
- Le « rendu » est sous forme de scores bruts
- Fournir une grille de correspondance entre les scores obtenus l'année N et ceux obtenus l'année N-1

Le cadre précédent (*common-items non-equivalent groups design*) n'est plus adapté.

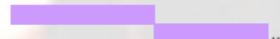
# Nouveau *design*

Pré-tests et post-tests :

Année  
N

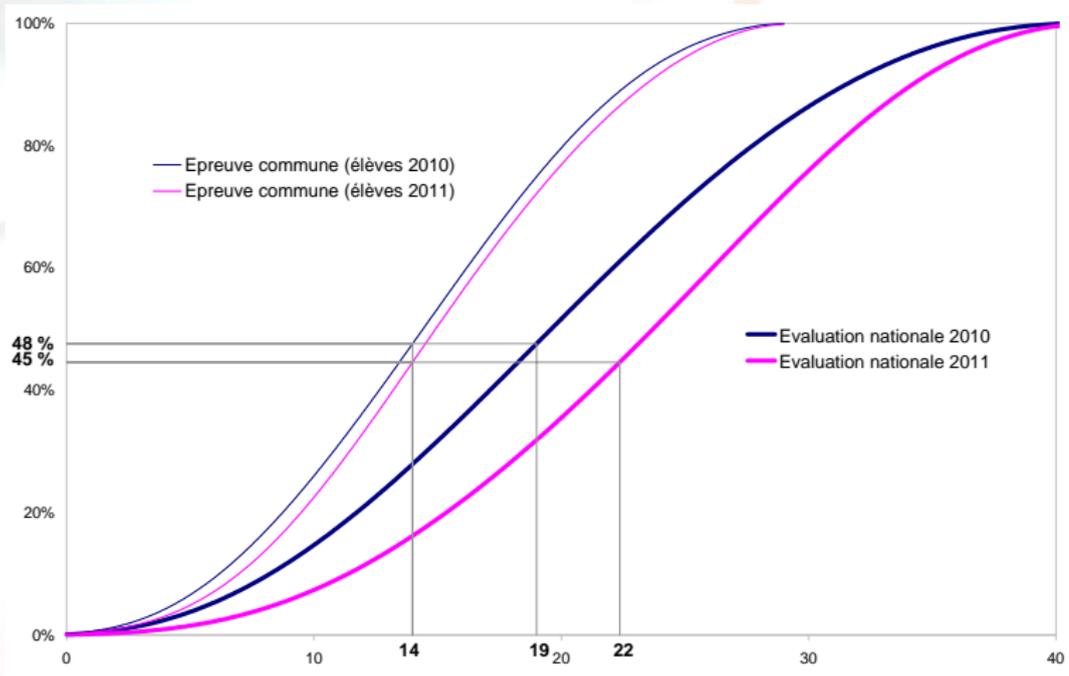


Année  
N+1



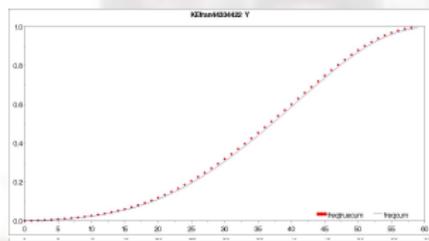
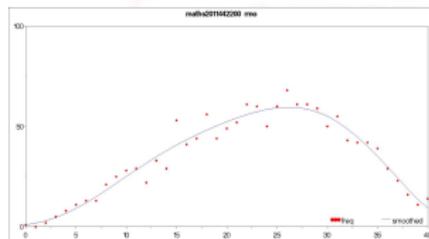


# Equipercentile chaîné (*Chained Equipercentile*)



# Procédure *Kernel equating* (Von Davier et al., 2004)

- 1 Lissage des distributions  
Modèle log-linéaire
- 2 Continuité des fonctions de répartition  
Méthode du noyau (non paramétrique)
- 3 Equating



$$\hat{e}_Y(x) = \hat{G}_{2010}^{-1} \left( \hat{H}_{2010} \left( \hat{H}_{2011}^{-1} \left( \hat{F}_{2011}(x) \right) \right) \right)$$



# MRI - Scores observés

Idée : « reconstruire » la distribution des scores observés sur B à partir des paramètres des items estimés selon un modèle MRI (2PL)

Si on note  $r$  le nombre d'items répondus,  $x$  le score observé et  $p_r$  la probabilité de réussir l'item  $r$ , on a la relation de récurrence suivante concernant la probabilité d'obtenir un score de  $x$  sur  $r$  items à un certain niveau de compétence  $\theta$  fixé :

$$\begin{cases} f_r(x/\theta) = f_{r-1}(x/\theta)(1 - p_{r/\theta}) & \text{si } x = 0 \\ f_r(x/\theta) = f_{r-1}(x/\theta)(1 - p_{r/\theta}) + f_{r-1}(x - 1/\theta)p_{r/\theta} & \text{si } 0 < x < r \\ f_r(x/\theta) = f_{r-1}(x - 1/\theta)p_{r/\theta} & \text{si } x = r \end{cases}$$

Cette méthode permet d'estimer une distribution de scores bruts à partir d'items qui n'ont pas été passés par les mêmes élèves

# Ajustement linéaire (Tucker)

Population *synthétique*  $S$  : année  $N$  et année  $N+1$

Sur  $S$ , les scores centrés-réduits sont égaux pour les deux tests, après avoir ajusté les scores  $X$  sur l'échelle de  $Y$

$$I_Y(x) = \frac{\sigma_S(Y)}{\sigma_S(X)} [x - \mu_S(X)] + \mu_S(Y)$$

où  $I_Y(x)$  est l'ajustement du score  $x$  au test  $X$  sur l'échelle des scores  $Y$ ,  $\mu$  la moyenne des scores et  $\sigma$  leur écart-type.

Deux hypothèses pour calculer les  $\mu$  et les  $\sigma$  :

- Régression de  $X$  en  $A$  - respectivement de  $Y$  en  $A$  - est la même pour les deux populations visées ( $N$  et  $N+1$ )
- Covariances conditionnelles  $cov(X/A)$  et  $cov(Y/A)$  sont également identiques quelle que soit la population

# Rasch (1)

Une approche « classique » consiste à utiliser les propriétés du modèle de Rasch :

$$P(Y_i^j = 1) = \frac{\exp(\theta_i - b_j)}{1 + \exp(\theta_i - b_j)}$$

où  $Y_i^j$  est la réponse de l'élève  $i$  à l'item  $j$ ,  $\theta_i$  le niveau de compétence de l'élève  $i$ ,  $b_j$  le niveau de difficulté de l'item  $j$

Une propriété intéressante de ce modèle est l'exhaustivité du score brut  $S_i = \sum_j (Y_i^j = 1)$ , c'est-à-dire que  $\theta_i$  et  $S_i$  sont liés par une relation bijective



# Rasch (3)

- Avantage : simplicité de mise en œuvre
- Inconvénient : adéquation au modèle de Rasch

Hypothèse très forte : discriminations des items homogènes.

Cette hypothèse est si forte qu'en général, les items sont sélectionnés de manière à ce qu'ils soient conformes à ce modèle.

# Ajustement MRI - Scores vrais

Relation entre « scores vrais » = relation entre scores observés

- 1 Estimation conjointe MRI (2PL) de tous les paramètres des items des tests ( $X, Y, A$ )
- 2 Pour un score vrai - nombre entier - fixé  $T_{Yi}$  obtenu au test  $Y$ , on cherche le  $\theta_i$  qui conduit à ce score.  
Le « score vrai » (au sens des MRI) :

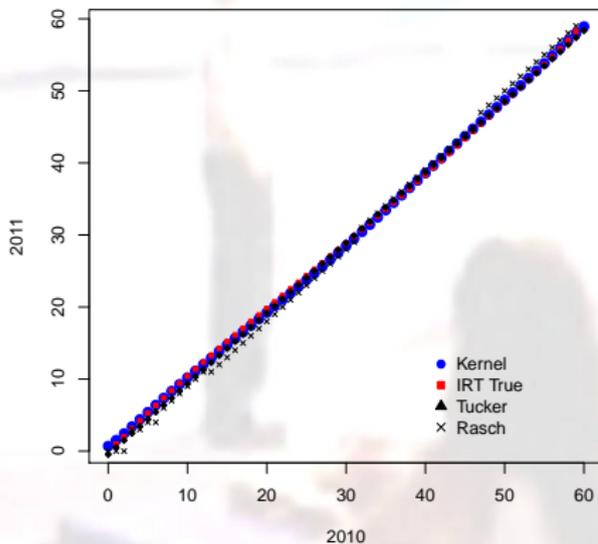
$$T_{Yi} = \sum_{j \in Y} P_j(\theta_i)$$

Equation non linéaire (algorithme de type Newton-Raphson)

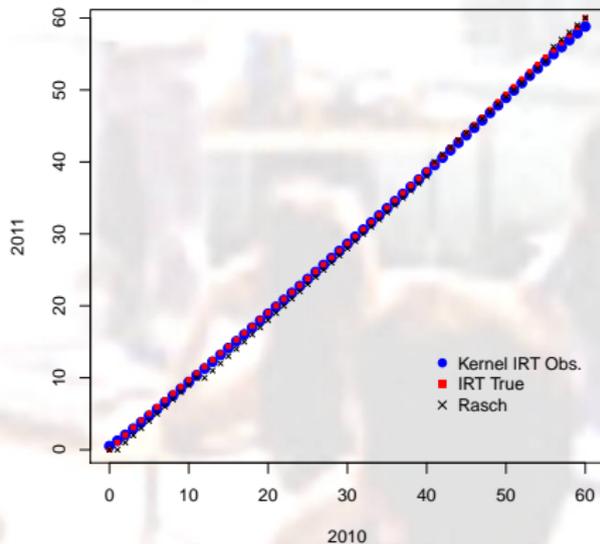
- 3 A partir du  $\theta_i$  trouvé, on calcule le score vrai aux items du test  $X$ .

# Français

## Stratégie A



## Stratégie B



# Mathématiques

## Stratégie A

